

# Doorlopend op Tijd

Toelichting achterstanden project CCR/praktijk

16 september 2009, Den Haag



# Topics

$\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$

- Doelstelling
- Gestructureerde aanpak
- Project: de eerste stap
- Vervolgtraject: analyse primair proces

# Doelstelling

$\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$

Strategische doelstelling 1: vanaf 2011 geen achterstanden in afhandeling van zaken

- Ad-hoc vs. structurele oplossingen
- Flexibel/robuust primair proces
- Achterstanden is een gedeeld probleem

COLLEGE  
TER BEHOEFEN VAN  
KONINKRIJKSDIENST  
 $\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$   
REGULERING  
EVALUATIE  
BOARD

Strategisch Business Plan 2009-2013

Grensverleggend reguleren: de poortwachter voorbij

© CBG-MEB

# Gestructureerde aanpak

$\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$

Methodologie: Lean six sigma

Lean staat voor **snelheid**, door stappen in processen te beperken tot die stappen die waarde toevoegen voor de "klant" (verbeteren doorlooptijden van ons proces).

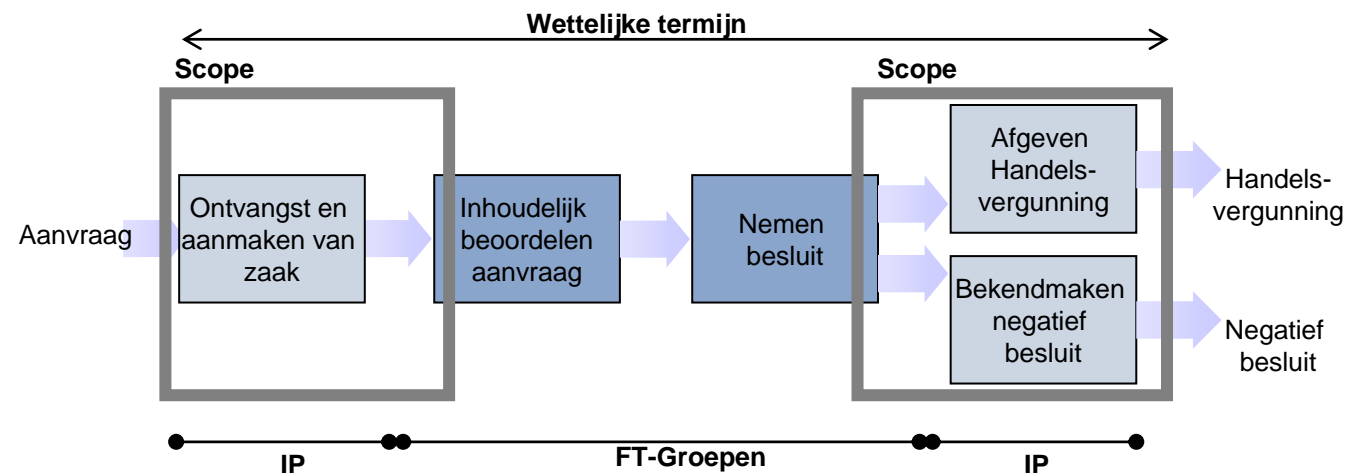
Six sigma staat voor het **reduceren van variabiliteit** gedurende dit proces.



# 'De eerste stap'

Scope van eerste project was beperkt tot twee deel processen

Een overzicht van problemen en oorzaken voor vertraging in doorlooptijd voor zowel 'Proces IP' als voor het 'Tekenrondje'.

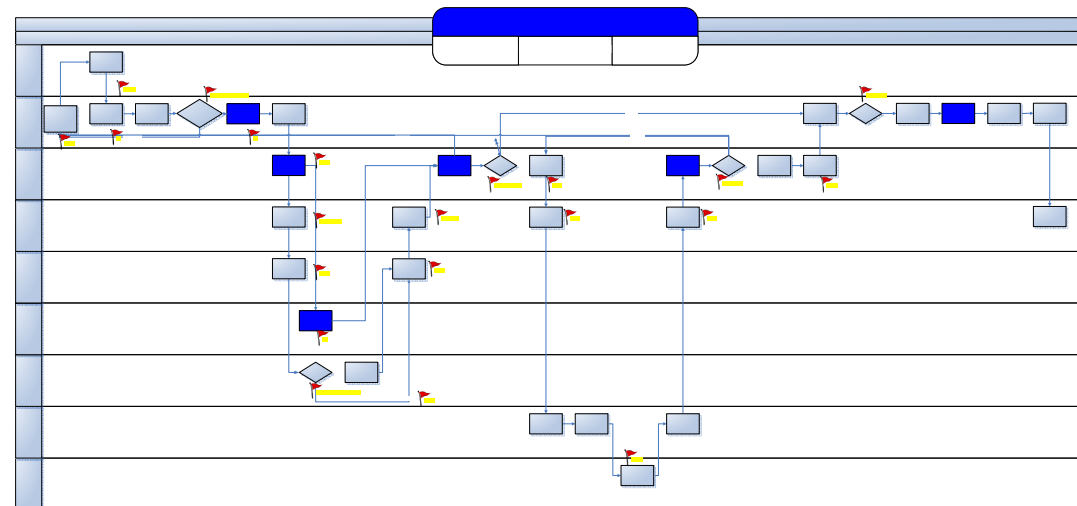
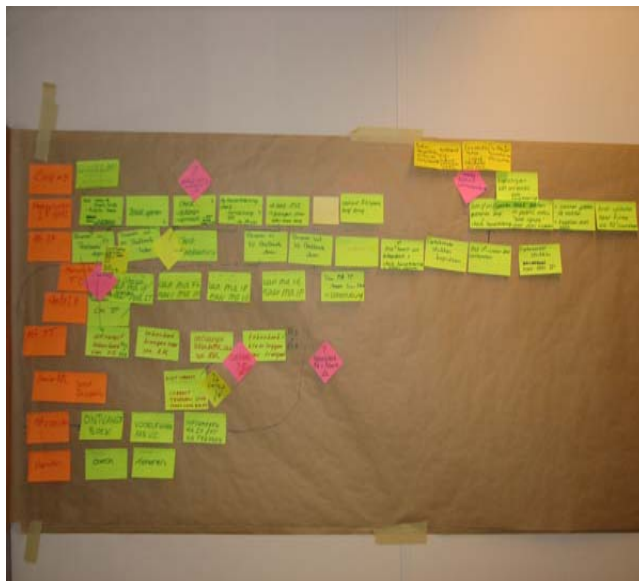


# 'De eerste stap': tekencircuit

$\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$

De belangrijkste bevinding is dat het tekencircuit in de tijd complex is geworden

- aantal betrokken functiegroepen
- veel transport en (mogelijke) wachttijden
- veel (administratieve) controle stappen

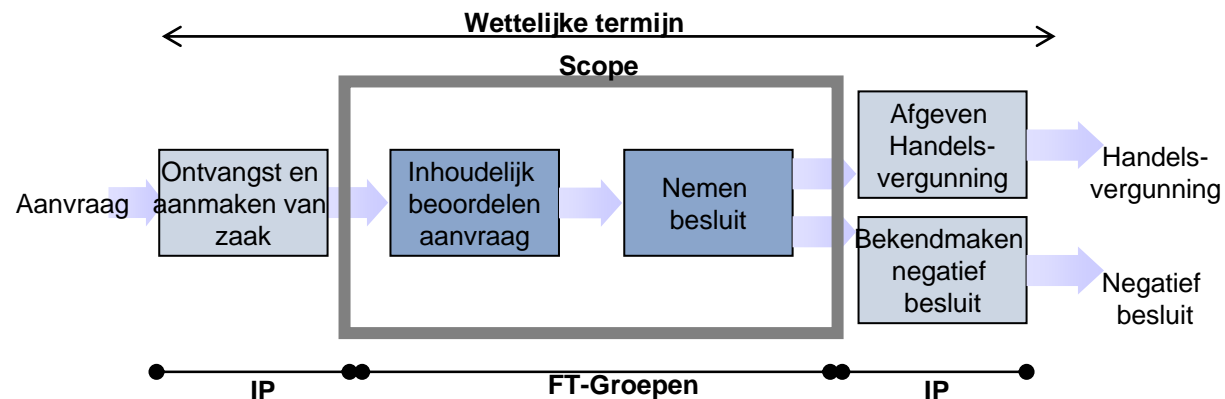


# Vervolgtraject: analyse primair proces

$\frac{c \ B \ G}{M \ E \ B}$

Initiële scope zal zich richten op **nationale producttypen** en **implementatietraject** van EU procedures

- In kaart brengen en optimaliseren van processen
- Herziening meetmethode/definitie van achterstanden
- Samenwerking/interactie CBG en industrie



# ...voor een volgende CCR/praktijk

$\frac{c \quad B \quad G}{M \quad E \quad B}$

- Actiepunt: prioritering van producttypen
- Eerste meetgegevens – nieuw meetmethode
- (nieuwe) definitie van achterstanden